

2012年10月27日

いつもお世話になってます皆様へ

感察工学研究会主査 石井明

国際画像機器展 2012 への出展の御案内

感察工学研究会では、本年12月5日（水）～7日（金）、パシフィコ横浜で開催される国際画像機器展2012において、1ブースを使って周辺視目視検査法の紹介・普及活動を行うことになりました。3年間の感察工学研究会活動の総括と位置付けています。ご多忙とは存じますが、是非とも、お越しいただき、御感想や御意見等をお願いできればと思います。

小間番号 24（出展社名：香川大学工学部）
出展名 “外観目視検査を成功させる秘訣を教えます” 周辺視目視検査法！！
紹介サイト http://www.adcom-media.co.jp/shousai_ite.php?id=93

見どころ

外観目視検査の一般的なイメージは「集中力」、「不良探し」であり、とにかくよく見ることが求められています。実は、これこそが見逃しが無くならない大きな要因です。その理由は、「集中力」が短時間しか持たないからです。それではベテラン検査員はどうしているかというと、「良品の確認」と「リズム」で検査をしています。その方法こそが周辺視目視検査法なのです。本出展では、周辺視目視検査法を理解できるようデモスライドと、実施例のビデオ上映および導入にあたっての相談コーナーを設けています。

セミナー

2日目の12月6日（木）16:00～16:50、2Fの一番奥のアネックスホールにおいて、“外観目視検査を成功させる秘訣を教えます”と題して、主査の石井明（香川大学）が講演を行います。周辺視目視検査法の理解と適用をわかりやすく説明致します。

参加方法

- (1) 展示会参加
本展示会は入場無料の登録制となり、ご来場いただくには招待状が必要です。
次のサイトに入り、招待状請求をお願いします。
<http://www.adcom-media.co.jp/ite/getinv/>
- (2) セミナー事前登録
セミナーの参加費は無料ですが、事前登録が必要となります。次のサイトに入って、別途登録してください。
http://www.adcom-media.co.jp/ite/seminar/6_1600_1/



匠級検査員による目視検査の様子

感察工学研究会（精密工学会画像応用技術専門委員会：2010.2～2013.1）

委員：石井明（主査：香川大学） 佐々木章雄（周辺視目視検査研究所） 角田興俊（東京電機大学） 丸地三郎
中島慶人・廣瀬文子（電力中央研究所） 中野宏毅・森由美（日本 IBM） 広瀬修（住友化学） 舟橋琢磨（中京大学）
劉偉・飛田奈穂美（ファースト） 有友秀樹・夏井隆博（日立 GST） 板垣忠司（CCS） 松本俊之（青山学院大学）
小川尚志・外崎真理子（アイフォーコム東京） 中村俊・小柴満美子（東京農工大学） 葛岡英一（大倉工業）
横井俊幸（本田洋行）

<http://www.eng.kagawa-u.ac.jp/~ishii/kansatsu/>